



中华人民共和国国家标准

GB/T 12843—91

半 导 体 集 成 电 路 微 处 理 器 及 外 围 接 口 电 路 电 参 数 测 试 方 法 的 基 本 原 理

General principle of measuring methods
of microprocessors and peripheral interface circuits' parameters
for semiconductor integrated circuits

1991-04-28 发布

1991-12-01 实施

国 家 技 术 监 督 局 发 布

中华人民共和国国家标准

半导体集成电路
微处理器及外围接口电路电参数
测试方法的基本原理

GB/T 12843—91

General principle of measuring methods
of microprocessors and peripheral interface circuits' parameters
for semiconductor integrated circuits

1 主题内容与适用范围

本标准规定了半导体集成电路微处理器及外围接口电路(以下简称器件)电参数测试方法的基本原理。

本标准适用于器件电参数的测试。

2 引用标准

SJ/Z 9015.2(IEC 748-2) 半导体器件 集成电路 第2部分数字集成电路

3 总要求

3.1 若无特殊说明,测试期间,环境或参考点温度偏离规定值的范围,应符合器件详细规范的规定。

3.2 测试期间,应避免外界干扰对测试精度的影响;测试设备引起的测试误差应符合器件详细规范的规定。

3.3 测试期间,施于被测器件的电源电压,应在规定值的±1%以内;施于被测器件的其他电参量的精度,应符合器件详细规范的规定。

3.4 被测器件与测试系统连接与断开时,不应超过器件的使用极限条件。

3.5 测试期间,测试设备或操作者应避免因静电感应而引起器件失效。

4 静态参数测试

4.1 输入高电平电流 I_{IH}

4.1.1 目的

本方法是用来测试输入端施加规定的高电平时,流入该端的电流。

4.1.2 测试原理图